

		△の数	訂正記事			担 当	検 図	年月日			△の数	訂正記事			担 当	検 図	年月日
△									△								
△									△								
適 用 規 格																	
定 格	使用温度範囲		-55℃ ～ +105℃ (注1)						保存温度範囲		-10℃ ～ +60℃ (注3)						
	使用湿度範囲		20% ～ 80% (注2)						保存湿度範囲		40% ～ 70% (注3)						
	適合コネクタ		DF51K-4S-2C(###)						電 流		AWG 30 : 0.5A AWG 28 : 1A AWG 22-26 : 2A						
	電 圧		250V AC/DC														
性 能																	
項 目			試 験 方 法						規 格						QT	AT	
構造																	
外観・構造・仕上げ			目視、寸法測定器にて測定する。						図面と合致していること。						○	○	
表示			目視にて確認する。												○	○	
電気的性能																	
低電圧、低電流下の接触抵抗			20mV 以下、1 mA (DC又は 1000 Hz)で測定する。						30 mΩ 以下						○	-	
絶縁抵抗			DC 500 Vで測定する。						1,000 MΩ MIN.						○	-	
耐電圧			AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。						せん絡・絶縁破壊がないこと。						○	-	
機械的性能																	
繰り返し動作 (Snメッキ)			30 回の抜き差しを行う。						①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。						○	-	
繰り返し動作 (Auメッキ)			50 回の抜き差しを行う。						①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。						○	-	
結合力及び離脱力 (Snメッキ)			適合コネクタで測定する。						①結合力 : 30.0 N以下 ②離脱力 : 1.0 N以上						○	-	
結合力及び離脱力 (Auメッキ)			適合コネクタで測定する。						①結合力 : 21.7 N以下 ②離脱力 : 1.0 N以上						○	-	
耐振性			周波数 10～55 Hz、片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 10サイクル試験する。						①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。						○	-	
耐衝撃性			加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸両方向 各 3 回試験する。						①1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損、ひび、部品のゆるみがないこと。						○	-	
環境的性能																	
定常状態の耐湿性			温度 +40 ± 2℃、湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。 (室温に1～2時間放置後測定)						①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 500 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。						○	-	
備考 (注1) 通電時の温度上昇を含む。 (注2) 結露のないこと。 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。																	
								製 図	担 当	検 図	承 認	リリース					
								J.S CHO	J.S CHO	S.M.LIM	S.M.LIM	ENG 2023.07.24 DEPT					
								21.05.14	21.05.14	21.05.14	21.05.14						
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。																	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目																	
HIROSE KOREA CO.,LTD.				製 品 規 格 表						製 品 名							
										DF51K-4P-2V(805)							
コード NO.(OLD)			図番.						製品コード						1 / 2		
CL			JLC4-633593						CL 6652-0091-4-805								

温度サイクル	温度 -55 → 105℃ 時間 30 →30分 を 5 サイクル 試験する。 槽の移し変えは時間は2～3分 (室温に1～2時間放置後測定)	①接触抵抗: 30 mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1,000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
耐熱性	温度 +105 ± 2℃中に96時間放置する。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1,000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
耐寒性	温度 -55 ± 3℃中に96時間放置する。	①接触抵抗: 30mΩ 以下 ②絶縁抵抗: 1,000 MΩ 以上 ③破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
はんだ耐熱性	リフロー時間 リフローサイクル数:2サイクル。最大 220℃以上の60秒持続時間。最大 ピーク温度:250℃で10秒。最大	外観の変形及び端子等に著しいガタがないこと。	○	—
はんだ付け性	はんだ温度 245℃、浸せき時間 5 秒間の はんだ付けを行う。	はんだ浸せき面の95%以上が新しいはんだ でぬれていること。	○	—
推奨温度プロファイル	鉛フリークリームはんだ温度プロファイル(推奨) リフロー回数: 2回 温度は端子リード部にて測定しています クリームはんだ種類、基板サイズ、その他の実装部材等の条件により、異なる場合がありますので、実装状態を十分にご確認の上ご使用願います。			

注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目				
HIROSE KOREA CO.,LTD.		製品規格表		製品名 DF51K-4P-2V(805)
コード NO.(OLD) CL	図番. JLC4-633593	製品コード CL 6652-0091-4-805		2/2